



本社

LayTec GmbH
Helmholtzstrasse 13-14
D-10587 Berlin
ドイツ
電話番号: (+)49 - 30 39 80 08 00
ファクス番号: (+)49 - 39 39 800 80 80
E-Mail: info@laytec.de
Web: www.laytec.de

日本における販売代理店

丸文株式会社
103-8577 東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1
丸文ダイヤビル
電話番号: (+)81 - 33 63 99 811
ファクス番号: (+)81 - 33 66 21 349
Web: <http://www.marubun.co.jp>

問い合わせ先

Mr. Yuto TOMITA
Sales Engineer
電話番号: (+)49 - 30 39 80 080 33
ファクス番号: (+)49 - 30 39 80 080 80
E-Mail: tomita@laytec.de

問い合わせ先

Mr. Yuichi NARUKE
Thin Film systems team
電話番号: (+)81 - 33 63 99 811
ファクス番号: (+)81 - 33 66 21 349
E-Mail: yuichi_naruke@marubun.co.jp

LayTec は、MOCVD、MBE などの薄膜工程に関する In situ モニタリングシステム分野におけるリーダーです。当社のリアルタイムセンサーは研究開発、大量生産現場の両方で使用されています。

当社の測定技術は、ウェハの蒸着工程中であっても、エピタキシャル成長特性（成長速度）、膜厚、ドーピングレベル、三元材料組成、表面粗度、ウェハ表面温度（真温度）、ウェハの曲率の項目についての非常に高精度な測定を可能にします！

当社の最新センサー **EpiCurve[®] TT** は、ウェハ選択的溫度、反射率の測定、最高 0.3 km^{-1} という抜群の分解能で、ウェハの曲率測定を同時に行います。

EpiTT センサーは、現在 GaN LED 製造向けに世界中各国で優先的に採用されており、最適化された二つの波長における高温測定と反射率測定との組み合わせにより放射率修正を行う温度測定技術を提供しています。**EpiRAS[®] TT** は、最先端のマルチウェハ用 In situ センサーです。これは、新規 GaAs および InP ベースのオプトエレクトロニクス・デバイスの研究開発用途として唯一のセンサーです。当社のセンサーは、放射率修正を行う高温測定、標準化反射率を用いたスペクトロスコーピー、反射率異方性スペクトロスコーピー（RAS）、レーザ曲がり測定 of 4 つの測定原理に基づいています。

In situ モニタリングにより得られたエピタキシャル成長プロセスの知識が増加したことで、開発サイクルが大幅に削減され、また優れた品質管理法の実現が可能となりました。

- 当社は、現在光学センサー技術および半導体エピタキシーの両分野において、長年にわたり社内に専門技術を有する世界唯一の企業です。
- 当社のセンサーのほぼ 30% は公立研究機関および世界各国の著名な研究機関グループで使用されており、材料/プロセスの新規発見事実を絶え間なく確保して、競合相手に対して当社のセンサー優位性を保っています。
- LayTec の高精度機器は容易にカスタマイズでき、顧客には、最大の性能を発揮できるように当社製品の使用に必要な最大限のサポートを提供しています。
- ソフトウェアは、新規アプリケーションに対応し、最新のデータベース項目を取り込むよう定期的にアップデート・改良されています。LayTec の登録顧客には、詳細なオンライン・サポートサービスの利用が可能です。
- 当社のセンサーを用いると、世界各国の主要 LED ならびに LASER 製造設備における製造ラインの MOCVD システムで日々証明されているように、また量子ドット VCSELs のような非常に複雑なデバイスに関しても歩留まり向上や納期短縮により製造コストを削減できます。